

제품 소개서

EW - 8SCT

와전류 복합 검사 장비



와전류 탐상 검사(ECT)란

정밀 기계 부품 생산시 발생하는 크랙, 열처리(이종재질 혼입), 탭 가공 불량 검사에 사용되는 비파괴 검사 기술로 품질과 생산성을 동시에 확보 가능하며 검사체에 비접촉식으로 와전류를 생성 후 변화된 와전류 값을 이용하여 검사하는 기술

활용 분야

[구조 검사]

(열처리 검사)



- 열처리 후 경도 불량
- 열처리 공정 누락
- 미열 처리
- 이종재질 선별

[크랙 검사]



- 미세 크랙
- 열처리 후 크랙
- 열간단조, 냉간단조 크랙
- 가공 시 크랙

[탭 검사]

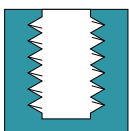


- 탭 뭉개짐
- 치간격 불량 외
- 철, 비철
(알루미늄, 구리, SUS 외)

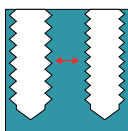
[복합 검사]

- 하나의 장비로 3가지 검사
구조 + 탭 + 크랙 검사 복합 구성 가능

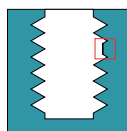
* 탭 불량 유형 예시



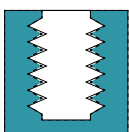
이중탭



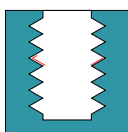
이중탭



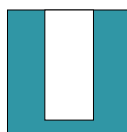
탭 칩킴(기공등)



소경불량



잔여 칩 검출



미가공

*주의: 소재의 재질 및 탭 가공부 형상에 따라 검출 특성이 다를 수 있음



[와전류 탐상 검사 센서]

EW - 8SCT



[장비 화면 예시]

자동 전수 검사

빠른 검사로 자동화 생산 라인에 적합

복합 검사 기능

구조 + 크랙 + 탭 불량 검사 가능

편리한 사용법

사용하기 편한 인터페이스와 조작법

다양한 채널 구성

‘구조 검사 / 크랙 검사 / 탭 검사 1~8 채널 구성 가능 (멀처리 검사)

양품 학습 기능

양품 학습을 통한 판정 범위 자동 설정

제품 사양서



전면



후면

모델명	EW - 8SCT
플랫폼	산업용 임베디드(Fanless)
채널 구성	크랙, 구조, 탭불량 검사 / 기본 1채널, 최대 8채널
주파수 범위	구조, 탭 검사 : 50Hz ~ 5MHz / 크랙 검사 : 1kHz ~ 10MHz
주파수	단일 가변 주파수
디스플레이	7 inch LED 터치 스크린
입출력	I/O, LAN, USB, RS232
크기	320 x 170 x 270mm (W * H * D)
중량	5.5kg (기본 1 채널 무게)
전원	100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz, 50W
사용 환경	온도 : -10 ~ 48℃
검사이력	별도 모듈 옵션
센서 파손 감지	실시간 모니터링



EddyWorks

Advanced Eddy Current Technology

대전광역시 유성구 관평동 1359번지 한신에스메카 230호 | www.eddyworks.co.kr
TEL : 042-867-3429 | FAX : 042-330-6429 | eddyworks@gmail.com

